

■ 用途 Application

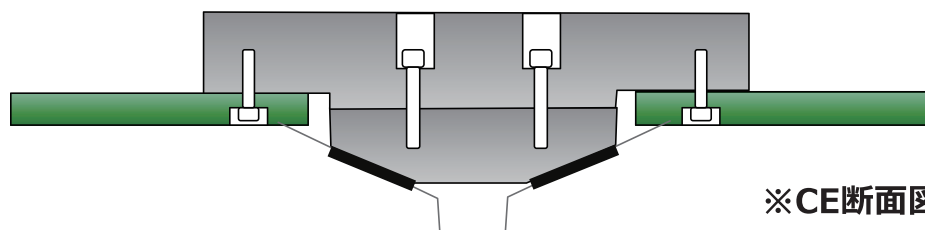
片持ち梁構造のカンチレバー型プローブカード。
CEシリーズはトランジスタ素子からアプリケーションプロセッサ等の
多種多様なロジックICの測定に最適なプローブカードです。

■ 特長 Feature

1. 合金針によるアルミパッドへの安定した接触性
2. 低針圧、低スクラブ化によるパッド下ダメージ低減
3. 低頻度クリーニングによる摩耗軽減
4. マルチ化によるテストコスト低減
5. 狭ピッチ（単列・千鳥）への対応

基本仕様 Specifications

パッドピッチ Pad Pitch	千鳥(Staggered)27 μ m	推奨OD時の針圧 Probe force	1.5gf@OD=60 μ m
	単列(In-line)40 μ m	最大OD Max OD	90 μ m
パッドサイズ Pad size	□50 μ m	基板下面～針先 Probe Depth	8.3mm \pm 0.3mm
	□60mm	最大電流 Max Current	250mA
針立て領域 Max Probe Area	※長辺方向は最大で150mm	使用温度 Temperature range	-40 $^{\circ}$ C～125 $^{\circ}$ C
		最大ピン数 Max Pin	4,000
針位置精度 Alignment	\pm 5 μ m		
高さバラツキ Planarity	13 μ m以内		



※CE断面図

Your Probing Partner



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
日本電子材料株式会社

<http://www.jem-net.co.jp/>